

Fédération Française de Chimie

G.A.M.S.

MESUCORA 82

Congrès MESUCORA : Journées du G.A.M.S.

Paris, 6-7 décembre 1982

Le G.A.M.S. apporte sa collaboration technique au Congrès Mesucora 1982 qui aura lieu dans le Grand Amphithéâtre de l'École Nationale Supérieure de Techniques Avancées (ENSTA), 32, boulevard Victor, Paris (15^e), située tout à proximité de l'Exposition qui, elle, se tiendra dans le Parc des Expositions de la Porte de Versailles.

Une plaquette contenant les programmes des différentes sessions ainsi que des renseignements pratiques et un formulaire d'inscription sera diffusée ultérieurement. Les Journées de 6 et 7 décembre ont été réservées au G.A.M.S.; le programme en est le suivant :

Lundi 6 décembre

Thème : L'informatique au service de l'analyste

Matinée : « Ordinateurs et microprocesseurs dans les laboratoires d'analyse ».

Président de séance : M. M. Feinberg, (Chef du Service de physicochimie au Laboratoire Central d'Hygiène Alimentaire, 43, rue de Dantzig, 75015 Paris).

A partir de 9 h,

- M. Perot (Nermag S.A., Rueil-Malmaison) : *Pilotage d'instrument de mesure et d'acquisition de signaux rapides.*
- M. P. Hellmann (Kontron Électronique, Vélizy-Villacoublay) : *Interfaçage et système d'exploitation. Applications à l'analyse chimique.*
- M. J. L. Lapeyre (Sté Fluidystème, Courbevoie) : *Calibration de systèmes automatiques d'analyse par microprocesseur.*
- M. J. L. Excoffier (École Polytechnique, Palaiseau) : *Étalonnage assisté par ordinateur, de détecteurs non linéaires.*
- M. S. Horvath (Technologie Servier, Orléans) : *Spectrométrie UV/visible micro-informatisée.*
- M. A. Funes (CERBA, Saint-Ouen-L'Aumône) : *Gestion informatisée d'un laboratoire de biologie spécialisé.*
- M. J. C. Bonnet (Télesystèmes, Questel DARC, Paris) : *Les applications du système DARC aux banques de données spectroscopiques.*

- Mme Claudine Durand, Mme F. Behar, M. J. C. Roussel, Mme Anne Girard, Mme M. Moureau (Institut Français du Pétrole, Rueil-Malmaison) : *Recherches informatisées dans les banques de données spectrales en ligne.*

Après-midi : « Logiciels spécialisés dans le traitement informatique de données chimiques ».

Président de séance : M. le Professeur R. Rosset (Laboratoire de chimie analytique des processus industriels, ESPCI, 10, rue Vauquelin, 75231 Paris Cedex 05).

- M. J. Desbarres (ESPCI, Paris) : *Quelques applications de la simulation graphique à la chimie analytique des solutions.*
- M. J. Grégoire (Sté Girdel, Puteaux) : *Élimination d'erreurs par défaut dues aux techniques statiques d'analyse du beadspace.*
- Mme M. F. Gonnord (École Polytechnique, Palaiseau) : *Traitement par autocorrélation d'un signal bruité. Application à la chromatographie.*
- M. J. L. Excoffier, C. Vidal-Madjar et G. Guiochon (École Polytechnique, Laboratoire de chimie analytique physique, Palaiseau) : *Mise en évidence de faibles différences de forme entre deux signaux. Application à la chromatographie.*
- M. Phan-Tan-Luu (I.U.T. d'Aix-en-Provence) : *Bon et mauvais usages de l'informatique dans les méthodes statistiques appliquées à la chimie.*
- M. H. Luc (CETIM, Nantes) : *Expérimentation factorielle appliquée à la correction des effets des tiers éléments en spectrométrie d'émission optique.*
- M. P. Trocellier et B. Nens (CEA, CEN-Saclay, Gif-sur-Yvette) : *Traitement informatisé des spectres de rétrodiffusion élastique de particules chargées.*

Mardi 7 décembre

Thème : Méthodes modernes d'analyse de surfaces

Matinée

9 h, Tran Minh Duc (Professeur à

l'Université de Lyon I) : *État actuel des méthodes d'analyse des surfaces.*

9 h 30, G. Slodzian (Professeur à l'Université de Paris-Sud et ONERA) : *Spectroscopie de masse des surfaces.*

10 h 45, J. Verbist (Professeur aux Facultés Universitaires de Namur, Belgique) : *Analyse de surfaces par spectroscopie d'électrons ESCA-Auger. Applications et limitations.*

11 h 20, J. Cazaux (Professeur à l'Université de Reims) : *Limites de détection en microanalyse des surfaces par spectroscopie d'électrons. Performances actuelles et tendances.*

11 h 45, B. Akamatsu, P. Henoc et P. Ossart (C.N.E.T., Bagneux) : *Évaluation de la résolution spatiale en microscopie électronique à balayage Auger à l'aide d'une simulation Monte-Carlo.*

Après-midi

14 h, J. Tousset (Professeur à l'Université de Lyon I) : *Méthodes nucléaires d'analyse de surfaces.*

14 h 40, J. C. Charbonnier (Chef du Département Surface - Analyse chimique, IRSID) : *Spectroscopie par décharge lumineuse.*

15 h 30, P. Siffert (Maître de recherches au C.N.R.S., Centre de Recherche Nucléaire, Strasbourg) : *Analyse de surfaces de semi-conducteurs.*

16 h, A. Friedrich (Chef de Service Analyses Physiques, Thomson CSF, Corbeville) : *Analyse de surfaces dans l'industrie électronique : performances nécessaires des instrumentalistes SIMS, Auger, ESCA, pour caractériser les matériaux semi-conducteurs et les dispositifs-composants, hyper-fréquence et laser...*

16 h 30, A. Cassuto (Directeur de recherche au C.N.R.S., Centre de Recherches sur les interactions gaz-solide, Nancy) : *Caractérisation de surfaces de catalyseurs.*

17 h, A. Mosser (Chargé de recherche au C.N.R.S., Université de Strasbourg) :

Analyses de surfaces en métallurgie.

Renseignements : G.A.M.S., 88, boulevard Malesherbes, 75008 Paris. Tél. 563.93.04.